

## XF-R 3-1 磁场探头(30MHz~6GHz)



### 描述:

XF-R 3-1 型近场探头，用于高分辨率直接检测组件上，比如 IC 的引脚或外壳、布线、旁路电容器等元器件区域的射频磁场。这种近场探头小巧轻便，并采用外皮电流衰减。磁场探头采用电屏蔽设计。这种近场探头可以接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。这些近场探头的内部安装有终端电阻。

### 具体指标:

频率范围	30 MHz ~ 6 GHz
分辨率	≈ 1 mm
探头尺寸	Ø ≈ 3 mm
输出接口	SMA
频率特性 [dBμV] / [dBμA/m]	
磁场校正曲线 [dBμA/m] / [dBμV]	
电流校正曲线 [dBμA] / [dBμV]	



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)